特 許 協 力 条 約

PCT

rec'd 23 OCT 2008 Wifta F67

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出題人又は代理人 の沓類記号 JST-91-PCT	今後の手続きについて		&告の送付通知 L 6)を参照する		
国際出願番号 PCT/JP03/00513	国際出願日 (日.月.年) 22.0	1.03	優先日 (日.月.年)	24. 01. 02	
国際特許分類(IPC) Int. Cl	7 H03H11/52				
出願人(氏名又は名称) 科学技術振興事業	団				
	The same was all the same to day also also also also also also also also		270661 64	用台下外,学品为了	
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を伝阅	行規則第57条(P(これるも余)の数	現在に使い送刊する。	
2. この国際予備審査報告は、この表記	氏を含めて全部で	3 ~-:	ジからなる。		
区 この国際予備審査報告には、	付属書類、つまり補正さ	れて、この報告の	基礎とされた及び	び/又はこの国際予備審	
査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT			すされている。		
この附属書類は、全部で 9					
3. この国際予備審査報告は、次の内容	3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
Ⅰ 図際予備審査報告の基礎					
II					
	Ⅲ 別 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
IV L 発明の単一性の欠如		•			
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため					
の文献及び説明 VI					
VII					
w 国際出願に対する意見					
国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告を	 作成した日		
20.06.03			7. 10. 03	3	
名称及びあて先		寺許庁審査官(権限	のある職員)	5 J 8 5 2 5	
日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915)	清水 稔	(贏)		
東京都千代田区設が関三丁目4番3号				1 内線 6442	

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/00513

I. 国際予備審査報告の基礎					
1. この国際予備審査報告は下記の出願啓類に基づいて作成された。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告啓において「出願時」とし、本報告啓には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)					
出願時の国際出願書類					
区 明細書 第 明細書 1,2,6-23 ページ、 出願時に提出されたもの 明細書 第 パージ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの ページ、 一次、 付の書簡と共に提出されたもの					
※ 請求の範囲 第					
図面 第 1/18-18/18 ページ /図 、出願時に提出されたもの 図面 第 ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 図面 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの					
明細書の配列表の部分 第 ページ、 出願時に提出されたもの 明細書の配列表の部分 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 明細書の配列表の部分 第 ページ、 付の書簡と共に提出されたもの					
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。					
上記の書類は、下記の言語である 語である。					
 ■ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 ■ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 ■ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 					
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。					
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された審面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。					
4. 補正により、下記の告類が削除された。					
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)					

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/00513

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	 性についての法第12条((PCT35条(2)) に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1, 4-13	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	4-13	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1, 4-13	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1 (JP 2 000-68788 A (科学技術振興事業団) 2000.03.03) 及び文献2 (JP 39-3222 B (インターナショナル、スタンダード、エレクトリック、コーポレーション) 1964.03.28) より進歩性を有さない。

文献2のFIG. 8及びFIG. 10に示されたN字型電圧-電流特性は、3次 (FIG. 10), 5次 (FIG. 8にてDOD'を1次の直線にて近似した場合), 7次 (FIG. 8にてDOD'を3次の直線にて近似した場合)の区分線形特性で近似しうるものである。また、「 Λ 字型の非線形抵抗回路とV字型の非線形抵抗回路とを多入力フローティングゲートMOSFETを用いて構成すること」は文献1に記載されている。

なお、例えば文献2に記載された電池電圧を連続的に変化させる等により、文献2 に記載されたN字型電圧-電流特性を連続的に変化させうることは当業者にとって自 明である。 Ó

流特性を合成するとともに、前記N字型電圧-電流特性を連続的に変化させ、3 次から7次までの各次数の区分線形特性で近似できる電圧-電流特性を実現する ことを特徴とする。

- [2]上記〔1〕記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記3次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の負性抵抗部をできるだけ線形にし、その両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [3]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記 3 次特性は、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及び V字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の負性抵抗部をできるだけ線形にし、その両方の特性を、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路のフローティングゲート P- チャネル M OSFET のドレイン端子と接地間の電圧及び前記 V 字型の非線形抵抗回路のフローティングゲート N- チャネル M OSFET のドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [4]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記4次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特

徴とする。

- [5]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記 4 次特性は、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [6]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記5次特性は、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記Λ字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [7]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記5次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [8]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記6次特性は、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧—電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧—電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記Λ字型

の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性を、前記Λ字型の非線形抵抗回路の入力端子とN-チャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とP-チャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とする。

- [9]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記6次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [10]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記7次特性は、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性を、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性を、前記Λ字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とする。
- [11]上記[1]記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記7次特性は、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性を、前記Λ字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネ

請 求 の 範 囲

- 1. (補正後) 多入力フローティングゲートMOSFETを用いたA字型の非線形抵抗回路とV字型の非線形抵抗回路を並列に接続し、前記A字型の非線形抵抗回路の電流と加算することにより、多様なN字型電圧一電流特性を合成するとともに、前記N字型電圧一電流特性を連続的に変化させ、3次から7次までの各次数の区分線形特性で近似できる電圧一電流特性を実現することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 2. (削除)

3

- 3. (削除)
- 4. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記3次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性の負性抵抗部をできるだけ線形にし、その両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれたと右方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 5. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記3次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の負性抵抗部をできるだけ線形にし、その両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とするフ

ローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。

U

- 6. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記4次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETとを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 7. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記4次特性は、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 8. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記5次特性は、前記Λ字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧一電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記Λ字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 9. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記5次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性の負性部分

の傾きを調

整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記 Λ 字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ左と右方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。

1

- 10. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた 非線形抵抗回路において、前記6次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧 電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記 A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFE Tを用いた非線形抵抗回路。
- 11. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路において、前記6次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性又はV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性のどちらかの特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧ー電流特性の両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧とび前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。
- 12. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた 非線形抵抗回路において、前記7次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧 -電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性の負性部

分の傾きを

2 6 / 1

調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記入字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性を、前記入字型の非線形抵抗回路の入力端子とNーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路の入力端子とPーチャネルMOSFETのドレイン端子間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。

13. (補正後) 請求項1記載のフローティングゲートMOSFETを用いた 非線形抵抗回路において、前記7次特性は、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧 - 電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性の負性部分の傾きを調整することにより、その特性自身に傾きの変化を持たせ、前記A字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性及びV字型の非線形抵抗回路の電圧-電流特性の両方の特性を、前記A字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートPーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧及び前記V字型の非線形抵抗回路のフローティングゲートNーチャネルMOSFETのドレイン端子と接地間の電圧によりそれぞれ横軸方向に並行移動させて合成することを特徴とするフローティングゲートMOSFETを用いた非線形抵抗回路。

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	(PC1 Milicio 30 a				
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTIO	N Examination	ionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)		
JST-91-PCT	International filing date (day/month/year)		Priority date (day/month/year)		
nternational application No. PCT/JP03/00513	22 January 2003 (2				
nternational Patent Classification (IPC) or r H03H 11/52	national classification and IPC				
Applicant JAPAN SC	CIENCE AND TECHNO	OLOGY COR	PORATION		
This international preliminary examinated to the applicant	mination report has been prep according to Article 36.	ared by this Inter	rnational Preliminary Examining Authority		
2. This REPORT consists of a total of	of sheets, inc	luding this cover	sheet.		
This report is also accompa		ets of the descrip	tion, claims and/or drawings which have been cations made before this Authority (see Rule		
These annexes consist of a	total of 9 she	ets.			
3. This report contains indications relating to the following items: 1 Basis of the report					
				II Priority	
III Non-establishme	ent of opinion with regard to r	ovelty, inventive	e step and industrial applicability		
IV Lack of unity of	invention				
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; VI Certain documents cited Certain defects in the international application			, inventive step or industrial applicability;		
			VII Certain defects in the same of the international application VIII Certain observations on the international application		
					·
Date of submission of the demand		Date of complet	ion of this report		
20 June 2003 (20	0.06.03)	(07 October 2003 (07.10.2003)		
Name and mailing address of the IPEA	√JP	Authorized offi	cer		
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/00513

I. Basis	s of the rep	port	
1. With	n regard to	the elements of the international application:*	
		national application as originally filed	
\boxtimes	the descr		
İ	pages _	1,2,6-23	, as originally filed
	pages _		, filed with the demand
	pages _	, filed with the letter of	,
\boxtimes	the claim		
	pages		se originally filed
	pages	, as amended (together with an	, as originally filed
	pages _	1,4-13	, filed with the demand
	pages _	, filed with the letter of	
\boxtimes	the drawi		
-	pages _	1/18-18/18	or originally filed
	pages _	7.70 10/10	, as originally filed
	pages	, filed with the letter of	, IIICG WILL GIO GOLIGIG
Πt	the sequenc	ce listing part of the description:	
L	pages	•	
	pages		, as originally filed
	pages _	, filed with the letter of	, filed with the demand
. With prelim	the languathe languathe languathe languathe languathe states of the languate of 55.3). regard to minary example contained filed together furnished at the states internation.	age of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b) age of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). age of the translation furnished for the purposes of international preliminary examina any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application was carried out on the basis of the sequence listing: in the international application in written form. ther with the international application in computer readable form. subsequently to this Authority in written form. subsequently to this Authority in computer readable form. ment that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyonal application as filed has been furnished.	ntion (under Rule 55.2 and/ plication, the international
	The amend the	diments have resulted in the cancellation of: description, pages claims, Nos2,3	
Replace	This report peyond the ement shee	has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they had disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** its which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain	
	•	sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this	



International application No.

PCT/JP03/00513

orting such statement	ency, inventive step or moustrial applicability;	,
Claims	1, 4-13	YES
Claims		NO
Claims	4-13	YES
Claims	1	NO
Claims	1, 4-13	YES
Claims		NO
	Claims Claims Claims Claims Claims Claims Claims	Claims 1, 4-13 Claims 4-13 Claims 1 Claims 1 Claims 1, 4-13

2. Citations and explanations

The invention described in claim 1 does not appear to involve an inventive step based on document 1 [JP, 2000-68788, A (Japan Science and Technology Corp.), 03 March, 2000] and document 2 [JP, 39-3222, B (International Standard Electronic Corporation), 28 March, 1964] cited in the ISR.

The N-shaped voltage – current characteristic shown in FIG. 8 and FIG. 10 of document 2 can be approximated by a sectional linear characteristic of a third order (FIG. 10), fifth order (a case in which DOD' is approximated by a first-order line in FIG. 8), and seventh order (a case in which DOD' is approximated by a third-order line in FIG. 8). Furthermore, document 1 describes that "Λ-shaped nonlinear resistance circuit and V-shaped nonlinear resistance circuit are configured by using a multiinput floating gate MOSFET".

Further, changing continuously the N-shaped voltage current characteristic described in document 2 by changing continuously the battery voltage described, for example, in document 2 is obvious to a person skilled in the art.